



芯海科技  
CHIPSEA

# CS1251 芯片 用户手册

带 24bits ADC 和 BIM 的高性能 AFE  
REV 1.3

芯海科技（深圳）股份有限公司

地 址：深圳市南山区蛇口南海大道1079号花园城数码大厦A座9楼

电 话：+(86 755)86169257      传 真：+(86 755)86169057

网 站：www.chipsea.com      邮 编：518067

微信号：芯海科技



## 版本历史

历史版本	修改内容	版本日期
REV 1.0	初始版本	2018-09-17
REV 1.1	ADC 斩波添加注意事项, page34	2018-10-12
REV 1.2	增加包装信息和产品丝印, page35~36	2018-10-24
REV 1.3	更新文件模板	2019-05-24

# 目 录

版本历史.....	2
目 录.....	3
图清单.....	5
表清单.....	6
<b>1 简介.....</b>	<b>7</b>
1.1 主要特性.....	7
1.2 应用场合.....	7
1.3 功能说明.....	7
1.4 极限值.....	8
1.5 电气特性.....	9
1.6 可靠性指标.....	10
1.7 产品型号及引脚.....	10
1.8 典型应用电路.....	11
<b>2 功能寄存器说明.....</b>	<b>12</b>
2.1 功能寄存器列表.....	12
2.2 功能寄存器说明.....	12
2.2.1 SYS—系统配置寄存器(地址 00H).....	12
2.2.2 ADC0— ADC 配置寄存器(地址 01H).....	13
2.2.3 ADC1— ADC 配置寄存器 1(地址 02H).....	13
2.2.4 ADC3— ADC 配置寄存器 3(地址 04H).....	14
2.2.5 ADC4— ADC 配置寄存器 4(地址 05H).....	14
2.2.6 ADC5— ADC 配置寄存器 5(地址 06H).....	15
2.2.7 BIM0— BIM 配置寄存器 0(地址 07H).....	15
2.2.8 BIM1— BIM 配置寄存器(地址 08H).....	16
2.2.9 ADO— ADC 转换数据寄存器(地址 09H).....	16
2.2.10 ADS— ADC 转换数据读取标准寄存器(地址 0AH).....	17
<b>3 功能描述.....</b>	<b>18</b>
3.1 输入选择.....	18
3.2 PGA 和 ADC.....	18
3.3 数字滤波器.....	19
3.3.1 频率响应.....	19
3.3.2 建立时间.....	19
3.4 人体阻抗测量.....	20
3.4.1 正弦信号发生器.....	21
3.4.2 激励电极及测量电极.....	22
3.4.3 整流.....	22
3.4.4 阻抗校准.....	22
3.5 参考电压源.....	23
3.6 内部时钟源.....	23
3.7 测量模式及其切换.....	24
3.8 多种工作模式.....	24
3.9 复位和掉电.....	24
<b>4 转换有效位.....</b>	<b>26</b>

<b>5 典型特性</b> .....	<b>27</b>
5.1 LDO 典型特性 .....	27
5.2 内部时钟典型特性 .....	27
5.3 BIM 典型特性.....	28
<b>6 三线串行通讯接口</b> .....	<b>32</b>
6.1 读时序.....	32
6.2 写时序.....	33
<b>7 封装</b> .....	<b>35</b>
<b>8 包装材料信息</b> .....	<b>36</b>
<b>9 产品丝印图说明</b> .....	<b>37</b>

## 图清单

图 1-1 CS1251 原理框图 .....	8
图 1-2 CS1251 引脚图 .....	10
图 1-3 CS1251 典型应用电路 .....	11
图 3-1 模拟输入结构图 .....	18
图 3-2 PGA 和 ADC 结构图 .....	18
图 3-3 COMB 滤波器的频率响应特性( $F_s=331\text{Hz}$ , $DR=10\text{Hz}$ , 3 阶 COMB) .....	19
图 3-4 COMB 建立过程 .....	20
图 3-5 BIM 模块结构图 .....	21
图 3-6 CS1251 低功耗工作示意图 .....	24
图 5-1 LDO 全电压全温度范围的典型特性(LDOS[1:0]=00, 负载 1mA) .....	27
图 5-2 内部时钟全电压全温度范围的典型特性 .....	27
图 5-3 FWR 模式下 220 欧姆纯电阻网络的测试结果 .....	28
图 5-4 FWR 模式下 510 欧姆纯电阻网络的测试结果 .....	28
图 5-5 FWR 模式下 1958 欧姆纯电阻网络的测试结果 .....	29
图 5-6 FWR+MIX 模式 510ohm+470pF 并联网络的阻抗绝对值测试结果 .....	29
图 5-7 FWR+MIX 模式 510ohm+470pF 并联网络的相位角测试结果 .....	30
图 5-8 FWR+MIX 模式 1018Ohm+10nF 并联网络的阻抗绝对值测试结果 .....	30
图 5-9 FWR+MIX 模式 1018Ohm+10nF 并联网络的相位角测试结果 .....	31
图 6-1 读操作时序 1(读 AD 值) .....	33
图 6-2 读操作时序 2(除 AD 值之外的寄存器) .....	33
图 6-3 写操作时序 .....	33
图 7-1 芯片封装尺寸信息 .....	35
图 8-1 SOP16 料管尺寸 .....	36
图 9-1 产品丝印图 .....	37

## 表清单

表 1-1 CS1251 极限值 .....	8
表 1-2 CS1251 电气特性 .....	9
表 1-3 CS1251 引脚说明 .....	11
表 2-1 功能寄存器列表 .....	12
表 2-2 SYS 寄存器说明 .....	12
表 2-3 ADC0 寄存器说明 .....	13
表 2-4 ADC1 寄存器说明 .....	13
表 2-5 ADC3 寄存器说明 .....	14
表 2-6 ADC4 寄存器说明 .....	14
表 2-7 ADC5 寄存器说明 .....	15
表 2-8 BIM0 寄存器说明 .....	15
表 2-9 BIM1 寄存器说明 .....	16
表 2-10 ADO 寄存器说明 .....	16
表 2-11 ADO 寄存器说明 .....	17
表 4-1 ADC 信号链不同配置下的有效位(ENOB) .....	26
表 6-1 串口通讯命令列表 .....	32
表 6-2 三线串行通讯接口时序表 .....	34

## 1 简介

### 1.1 主要特性

- ◇ BIM
  - 支持 4 电极测量
  - 支持 5K/10K/25K/50K/100K/250KHz 多档频率测量
  - 支持阻抗绝对值和相角测量
- ◇ ADC
  - 24-bit 分辨率
  - 输出速率 10~1280Hz 8 档可选
- ◇ ADC 有效位
  - 2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下 19.5bits 有效位
- ◇ LDO 及内部参考电压
  - 自带 LDO，输出 2.35/2.45/2.8/3.0V 可选
- ◇ 支持高性能、普通、低功耗、休眠模式
- ◇ 支持电压测量、BIM 测量及手动测量模式，可通过单命令切换
- ◇ 低漂移片上时钟
- ◇ 三线串行通讯

### 1.2 应用场合

人体阻抗分析  
交流测脂  
心率测量

### 1.3 功能说明

CS1251 原理框图如图 1-1 所示。

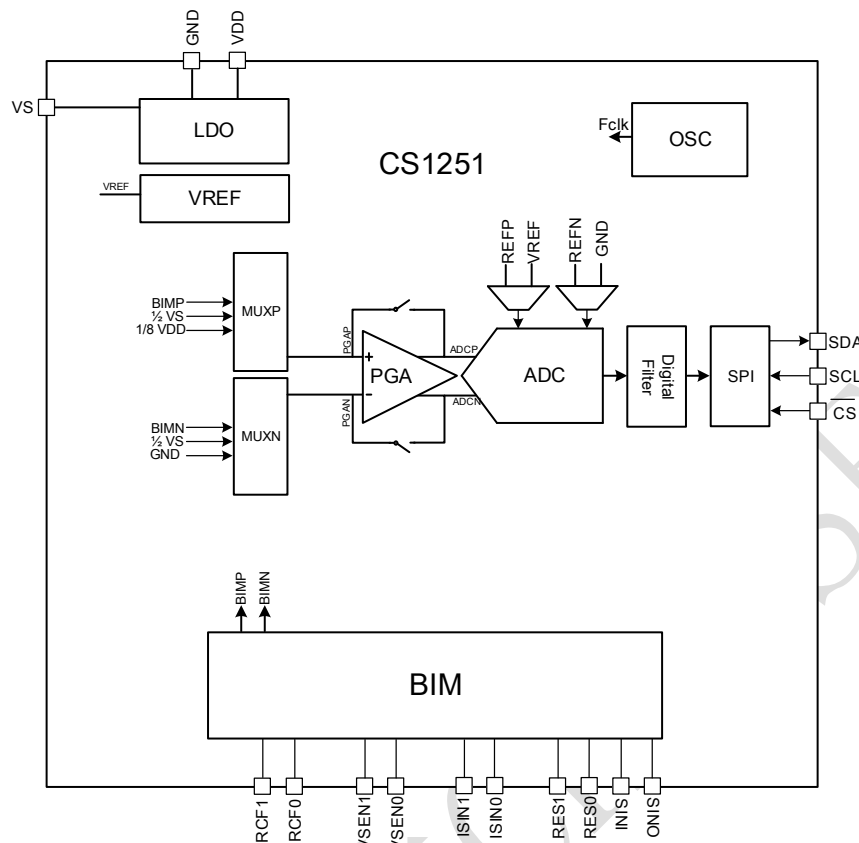


图 1-1 CS1251 原理框图

CS1251 包含 1 路 ADC 信号链和 1 个人体阻抗测量模块(BIM)，其中 ADC 信号链由输入 MUXP/MUXN、可编程低噪声增益放大器(PGA)、Sigma-delta ADC 以及数字滤波器 Digital Filter 等组成。MUXP/MUXN 具有 3 个内部输入通道，PGA 和 ADC 具有多种增益选择，数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源，将人体阻抗转化为电压信号送到 ADC 信号链进行测量，支持多电极、多频率人体阻抗测量。

CS1251 内置有低漂移 LDO 和电压基准 VREF，高精度振荡器 OSC 等。

CS1251 可以通过 3 线串行接口进行多种功能模式的配置，例如可以配置用于人体阻抗分析、电源电压检测等。

### 1.4 极限值

CS1251 极限值如表 1-1 所示。

表 1-1 CS1251 极限值

名称	符号	最小	最大	单位
电源电压	VDD	-0.3	6	V
电源瞬间电流			100	mA
电源恒定电流			10	mA
数字管脚输入电压		-0.3	VDD+0.3	V
数字输出管脚电压		-0.3	VDD+0.3	V



结温			150	°C
工作温度		-40	85	°C
储存温度		-60	150	°C
芯片管脚焊接温度			300	°C

## 1.5 电气特性

整个芯片供电电压为 2.4V~3.6V，工作温度为-40°C~85°C，设计指标如下表所示。

表 1-2 CS1251 电气特性

(Test Condition: VDD=3.0V, 25°C, VS=2.35V;)

参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位	
BIM	DAC 分辨率			6		BIM	
	DAC 速率			1		MSPS	
	正弦激励波频率		5	50	250	KHz	
	正弦激励电流			375 <sup>1)</sup>		uA	
	动态范围		0		2*限流电阻		
	线性度	0~1*限流电阻			0.5		
0~2*限流电阻				1			
LDO & VREF	VS电压	LDOS[1:0]=01	2.35	2.45	2.6	LDO & VREF	
	VS温漂			30		ppm/°C	
	VREF电压 <sup>2)</sup>		1.197	1.225	1.239	V	
	VREF温漂			30		ppm/°C	
时钟	频率			5.898		时钟	
	trim精度			1		%	
	频率全温度变化			2		%	
	频率全电压变化			1		%	
数字	V <sub>IH</sub>		0.7×VDD		VDD+0.1	数字	
	V <sub>IL</sub>		GND		0.2×VDD	V	
	V <sub>OH</sub>	I <sub>oh</sub> =1mA	VDD-0.4		VDD	V	
	V <sub>OL</sub>	I <sub>oL</sub> =1mA	GND		0.2+GND	V	
	I <sub>IH</sub>	V <sub>I</sub> =VDD			1	uA	
	I <sub>IL</sub>	V <sub>I</sub> =GND	-1			uA	
	F <sub>clk</sub>				F <sub>osc</sub> /4	MHz	
电源及模块功耗	电源电压	VDD	2.4	3	3.6	电源及模块功耗	
	LDO工作电流			160 <sup>3)</sup>		uA	
	VREF工作电流	启动温度补偿			280 <sup>4)</sup>		
		不启动温度补偿			210 <sup>5)</sup>		uA

	BIM工作电流	正弦波50KHz		1.1		mA
	OSC工作电流	Freq=5.898MHz		78		uA
	数字工作电流	正常工作		230		uA
Power down			0.2		uA	
整体功耗	BIM应用	BIM测量模式		1.5		整体功耗

1): 该电流值为限流电阻为 2Kohm 时，正弦频率为 50KHz 时的典型值，调节限流电阻可以调节该电流大小，且电流随正弦频率不同略有差别。

2): 此数据为基于设计仿真。

3)、4)、5): LDO 和 VREF 工作电流均包括了内部 Bandgap 模块的工作电流，因此两个模块同时打开时，电流不是简单相加，LDO+VREF（不启动温度补偿）电流为 260uA。

### 1.6 可靠性指标

(1) ESD: HBM  $\pm 6kV$ , Latch up:  $\pm 1A$

### 1.7 产品型号及引脚

CS1251 具有 4 电极 BIM 测量通道，采用 SOP-16 封装，引脚图 下图所示。

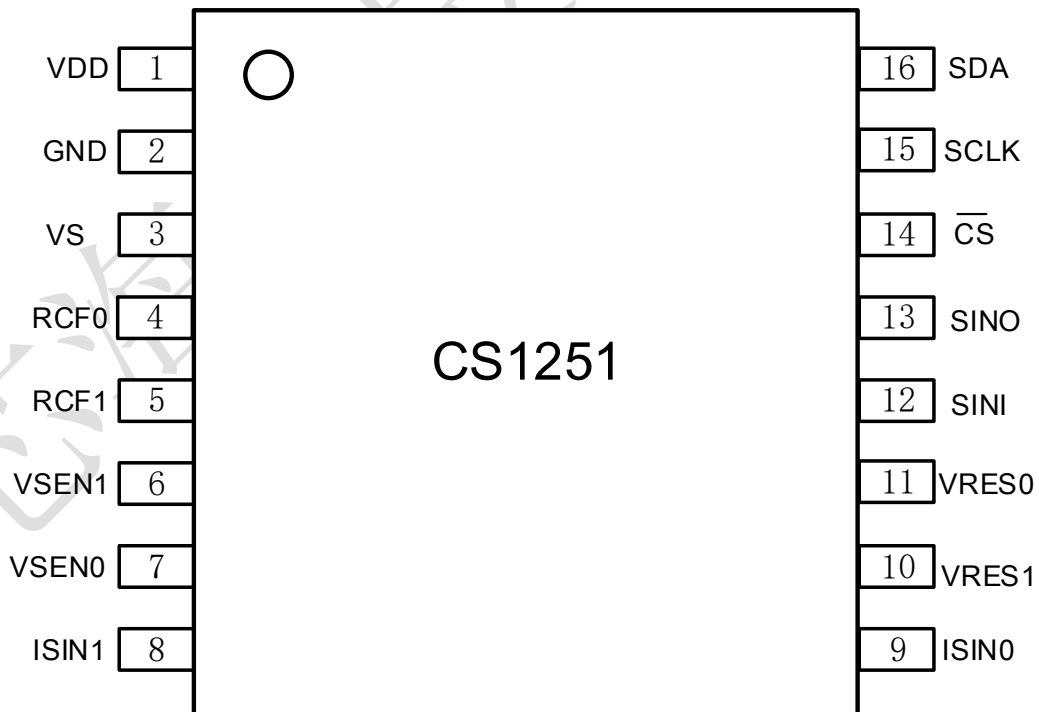


图 1-2 CS1251 引脚图

引脚说明如下表所示。

表 1-3 CS1251 引脚说明

引脚序号	引脚名称	输入/输出	说明
1	VDD	P	电源
2	GND	P	地
3	VS	O	LDO 输出端口
4	RFC1	O	整流输出端口 1
5	RFC0	O	整流输出端口 0
6	VSEN1	I	电压检测电极输入通道 1
7	VSEN0	I	电压检测电极输入通道 0
8	ISIN1	O	激励电流输出电极通道 1
9	ISIN0	O	激励电流输出电极通道 0
10	VRES1	I	参考电阻 1 接入通道
11	VRES0	I	参考电阻 0 接入通道
12	SINI	I	正弦激励输入端口
13	SINO	O	正弦激励输出端口
14	$\overline{CS}$	I	片选信号端口
15	SCLK	I/O	串行通讯时钟端口
16	SDA	I/O	串行通讯数据端口

### 1.8 典型应用电路

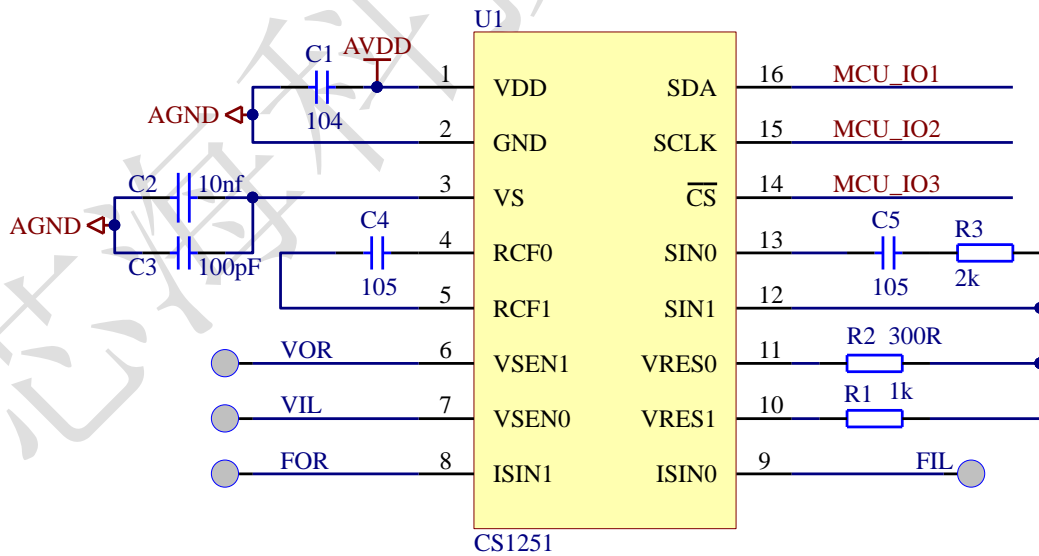


图 1-3 CS1251 典型应用电路

(该电路图为最小系统配置，仅供参考，量产电路图请以相关应用笔记为准)

## 2 功能寄存器说明

### 2.1 功能寄存器列表

表 2-1 功能寄存器列表

寄存器		比特位								默认值
地址	名称	BIT7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	
00H	SYS	TMODE[1:0]		PMODE[1:0]		ENREF	ENADC	ENLDO	ENBIM	00H
01H	ADC0	IMOD	FS_SEL	INNS[2:0]			INPS[2:0]			00H
02H	ADC1	DR[2:0]		BUFBP	PGA[1:0]		ADGN[1:0]		00H	
03H	ADC2	NA								00H
04H	ADC3	GTCSL	GTC[2:0]			NA				00H
05H	ADC4	CHOPM[1:0]		ACCU_NUM[1:0]		ADREFS[1:0]		LDOS[1:0]		40H
06H	ADC5	NA				REG_NC	FIL_EN	FIL_CON1	FIL_CON0	00H
07H	BIM0	ISINO[1:0]		ISINI[1:0]		VSENP[1:0]		VSENN[1:0]		00H
08H	BIM1		MIX_EN	BIMMODE[1:0]		DACFREQ[3:0]			00H	
09H	ADOH	ADO[23:16]								00H
	ADOM	ADO[15:8]								00H
	ADOL	ADO[7:0]								00H
0AH	ADS	ADS	RST							00H

### 2.2 功能寄存器说明

#### 2.2.1 SYS—系统配置寄存器(地址 00H)

表 2-2 SYS 寄存器说明

Bits	描述	权限	默认值	
[7:6]	TMODE[7:6]	<b>测量模式控制位</b> 11: BIM 测量模式 (置 INPS[2:0]=110, INNS[2:0]=110, LVSHIFT=0, PGA[1:0]=00, BUFBP=0, ADGN[1:0]=00, ADREFS[1:0]=00, FS_SEL=0, IMOD=0, 相应寄存器配置无效;其它由寄存器决定) 10: 电源电压测量模式 (置 ENREF=1, INPS[2:0]=100, INNS[2:0]=100, LVSHIFT=0, PGA[1:0]=00, BUFBP=0, ADGN[1:0]=00, ADREFS[1:0]=10, FS_SEL=0, IMOD=0, 相应寄存器配置无效;其它由寄存器决定) 01: N/A 00: 手动测量模式 (自由配置)	r/w	00'b
[5:4]	PMODE[1:0]	<b>工作模式控制位(仅在 TMODE=00 时)</b> 11: 自由模式 (ADC 自由配置) 10: 占空比模式, DR=640Hz (FS_SEL=0, BUFBP=0, IMOD=0, ENADC 和 ENLDO 受控制) 01: 高性能模式	r/w	00'b

		(FS_SEL=1, BUFBP=0, IMOD=1, 相应寄存器配置无效;其他配置由相应寄存器决定) 00:普通模式 (当前不可用) (FS_SEL=0, BUFBP=1, IMOD=0, 相应寄存器配置无效;其它配置由相应寄存器决定)		
[3]	ENREF	<b>VREF 模块使能信号</b> 1:VREF 使能 0:VREF 关闭	r/w	0'b
[2]	ENADC	<b>ADC 模块使能位</b> 1:ADC 使能 0:ADC 关闭	r/w	0'b
[1]	ENLDO	<b>LDO 模块使能位</b> 1:LDO 使能 0:LDO 关闭	r/w	0'b
[0]	ENBIM	<b>BIM 模块使能位</b> 1:BIM 使能 0:BIM 关闭	r/w	0'b

### 2.2.2 ADC0— ADC 配置寄存器(地址 01H)

表 2-3 ADC0 寄存器说明

Bits	描述		权限	默认值
[7]	IMOD	<b>调制器 MOD 电流控制位</b> 1:高性能模式电流=普通模式电流×2 0:普通模式电流	r/w	0'b
[6]	FS_SEL	<b>采样频率选择位</b> 1:662.22KHz 0:331.11KHz	r/w	0'b
[5:3]	INNS[2:0]	<b>PGA 负端输入信号选择位</b> 111:N/A 110:BIMN (仅在 TMODE=11 时有效) 101:1/2 VS (共模电压) 100:GND (仅在 TMODE=10 有效) 011~000:NA	r/w	000'b
[2:0]	INPS[2:0]	<b>PGA 正端输入信号选择位</b> 111:N/A 110:BIMP (仅在 TMODE=11 时有效) 101: 1/2 VS (共模电压) 100: 1/8 VDD (仅在 TMODE=10 有效) 011~000:NA	r/w	000'b

### 2.2.3 ADC1— ADC 配置寄存器 1(地址 02H)

表 2-4 ADC1 寄存器说明

Bits	描述		权限	默认值
[7:5]	DR[2:0]	<b>ADC 输出速率选择位</b> 111:1280Hz 110:640Hz 101:320Hz	r/w	000'b

		100:160Hz 011:80Hz 010:40Hz 001:20Hz 000:10Hz		
[4]	BUFBP	<b>Buffer 控制位</b> 1:Buffer 关闭（当前不可用） 0:Buffer 开启	r/w	0'b
[3:2]	PGA[1:0]	<b>PGA 增益选择位</b> 11:Gain=32 10:Gain=16 01:Gain=1 00:Gain=1	r/w	00'b
[1:0]	ADGN[1:0]	<b>调制器增益选择位</b> 11:Gain=8（DR 下降为设定值的 1/4） 10:Gain=4（DR 下降为设定值的 1/2） 01:Gain=2 00:Gain=1	r/w	00'b

### 2.2.4 ADC3— ADC 配置寄存器 3(地址 04H)

表 2-5 ADC3 寄存器说明

Bits	描述	权限	默认值	
[7]	GTCSL	<b>增益温漂补偿粗细选择位:</b> 1:粗调=精调×6，用于补偿传感器温漂 0:精调，用于调整芯片自身温漂	r/w	0'b
[6:4]	GTC[2:0]	<b>增益温漂补偿选择位(CTCSL=0):</b> 111:15 ppm/°C 110:10 ppm/°C 101:5 ppm/°C 100:0 000:0 001:-5 ppm/°C 010:-10 ppm/°C 011:-15ppm/°C	r/w	000'b
[3:0]		NA		

### 2.2.5 ADC4— ADC 配置寄存器 4(地址 05H)

表 2-6 ADC4 寄存器说明

Bits	描述	权限	默认值	
[7:6]	CHOPM[1:0]	<b>仪放(IA)及调制器(MOD)斩波频率控制位</b> 11: 仪放斩波频率为 fs_clk/64,调制器斩波频率为 fs_clk/128 10: 仪放斩波频率为 fs_clk/32,调制器斩波频率为 fs_clk/128 01:仪放斩波频率为 fs_clk/32,调制器斩波频率为 fs_clk/256	r/w	01'b

		00:不开斩波 fs_clk 为 MOD 采样频率 注意：默认斩波打开，请按推荐值使用												
[5:4]	ACCU_NUM [1:0]	<b>占空比模式下 COMB 数据累加个数选择</b> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ACCU_NUM</td> <td>累加个数</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>64</td> </tr> </table> 注意：(COMB 数据累加个数+4)*ADC 输出速率不能大于 COMB 速率 640Hz。	ACCU_NUM	累加个数	00	8	01	16	10	32	11	64	r/w	00'b
ACCU_NUM	累加个数													
00	8													
01	16													
10	32													
11	64													
[3:2]	ADREFS[1:0]	<b>ADC 参考电压选择位</b> 11:正参考=内部 VREF,负参考=GND 10: 正参考=内部 VREF,负参考=GND 01:正参考=VREF 外接 REFP 再接回 ADC 负参考=外部 REFN 00:正参考=外部 REFP,负参考=外部 REFN	r/w	00'b										
[1:0]	LDOS [1:0]	<b>内部 LDO 输出 VS 电压选择位</b> 11:3.0V 10:2.8V 01:2.45V 00:2.35V	r/w	00'b										

### 2.2.6 ADC5— ADC 配置寄存器 5(地址 06H)

表 2-7 ADC5 寄存器说明

Bits	描述	权限	默认值	
[7:4]	NA	NA		
[3]	REG_NC	<b>保留位</b>		
[2]	FIL_EN	<b>COMB 之后的低通滤波器使能控制信号</b> 1:滤波器打开 0:滤波器关闭 注：在占空比模式下不可以使用；速率为 10Hz、20Hz、40Hz、80Hz 不可以使用。	r/w	0'b
[1]	FIL_CON1	<b>滤波器级联控制</b> 0:滤波器使用级联结构 1:滤波器不使用级联结构	r/w	0'b
[0]	FIL_CON0	<b>滤波器系数控制</b> 0:使用系数 1 1:使用系数 2	r/w	0'b

### 2.2.7 BIM0— BIM 配置寄存器 0(地址 07H)

表 2-8 BIM0 寄存器说明

Bits	描述	权限	默认值	
[7:6]	ISINO[1:0]	<b>正弦激励电流输出通道选择位</b> 00: ISINO	r/w	00'b

		01:ISIN1 其它: NA		
[5:4]	ISINI[1:0]	<b>正弦激励电流接收 通道选择位</b> 00: ISIN0 01:ISIN1 其它: NA	r/w	00'b
[3:2]	VSENP[1:0]	<b>电压检测正电极通道选择位</b> 00: VSEN0 01:VSEN1 其它: NA	r/w	00'b
[1:0]	VSENN[1:0]	<b>电压检测负电极通道选择位</b> 00: VSEN0 01:VSEN1 其它: NA	r/w	00'b

### 2.2.8 BIM1— BIM 配置寄存器(地址 08H)

表 2-9 BIM1 寄存器说明

Bits	描述		权限	默认值
[7]	NA		r/w	0'b
[6]	MIX_EN	<b>解调模式选择位</b> 1:MIX 解调模式 0:全波整流模式	r/w	0'b
[5:4]	BIMMODE [1:0]	<b>BIM 模式选择位</b> 11:内短模式 10:校准电阻 1 模式 01:校准电阻 0 模式 00:测量模式	r/w	00'b
[3:0]	DACFREQ[3:0]	<b>正弦电流输出频率选择位</b> 101:250KHz 100:100KHz 011:50KHz 010:25KHz 001:10KHz 000:5KHz	r/w	0000'b

### 2.2.9 ADO— ADC 转换数据寄存器(地址 09H)

表 2-10 ADO 寄存器说明

Bits	描述		权限	默认值
ADOH[7:0]	ADO[23:16]	ADC 转换值的[23:16]位	r	00H
ADOM[7:0]	ADO[15:8]	ADC 转换值的[15:8]位	r	00H
ADOL[7:0]	ADO[7:0]	ADC 转换值的[7:0]位	r	00H



## 2.2.10 ADS— ADC 转换数据读取标准寄存器(地址 0AH)

表 2-11 ADO 寄存器说明

Bits	描述		权限	默认值
[7]	ADS	<b>ADO 中数据读取标志</b> 1:数据已经被读取 0:数据尚未被读取	r	0'b
[6]	RST	<b>芯片上电复位标志位</b> 1:芯片上电复位完成 0:用户查询该标志后自动清零	r	0'b
[5:0]	NA			000000'b

### 3 功能描述

#### 3.1 输入选择

CS1251 中模拟输入通道及内部若干信号分别通过 MUXP 和 MUXN 后，接到 PGA 正端和负端，如图 3-1 所示。

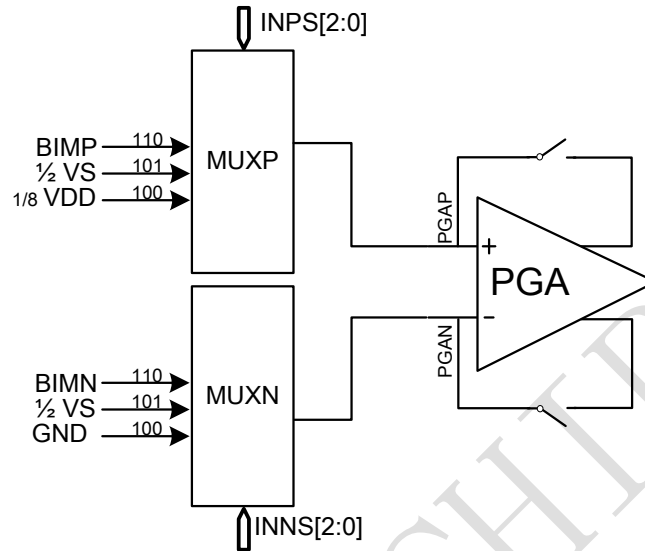


图 3-1 模拟输入结构图

$1/8 VDD$  和  $GND$  配对进行电源电压测量， $1/2 VS$  用于内短进行失调校正， $BIMP/BIMN$  是来自 BIM 模块的差分信号。

#### 3.2 PGA 和 ADC

CS1251 通过一个低噪声，低漂移的 PGA 放大器将输入信号放大后送入一个 2 阶的 Sigma-Delta ADC 进行模数转换。图 3-2 为 PGA 和 ADC 的结构图，其中 PGA 的增益由  $PGA[1:0]$  选择，具有  $1\backslash 16\backslash 32$  四档可选，ADC 的增益由  $ADGN[1:0]$  所选择、具有  $1\backslash 2\backslash 4\backslash 8$  四档可选，另外 ADC 参考电压来自输入的  $REFP-REFN$ 。

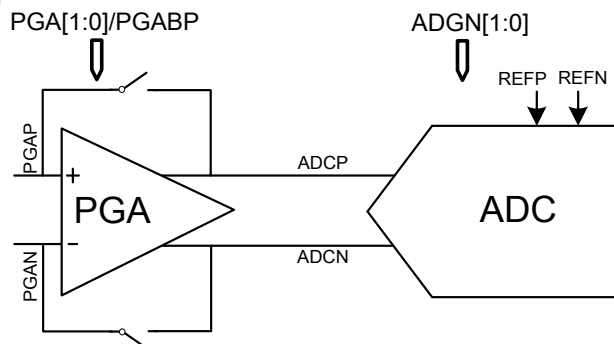


图 3-2 PGA 和 ADC 结构图

输入信号的增益 Gain 由 PGA 和 ADC 各自增益的乘积决定。

$$Gain = PGA \times ADGN \quad (\text{式 3-1})$$

为了提高信号的建立表现，PGA 输出到 ADC 调制器输入还有 Buffer 作为缓冲；但同时提供 Buffer 旁路功能，将 BUFBP 置'1'，则 Buffer 被旁路，PGA 输出信号直接接入 ADC 的调制器。CS1251 的差分满幅输入范围 FS 由 Gain 决定，

$$FS = (REFP - REFN) / Gain \quad (\text{式 3-2})$$

若差分输入通道  $AINp-AINn=VIN$ ，则为保证不溢出，VIN 的范围必须小于 FS。

CS1251 的 ADC 采用 2 阶 sigma-delta 调制器实现，内部采样频率为 331.11KHz(普通模式)或 662.22KHz(高性能模式)；增益 ADGN 可由电容倍增和频率倍增实现。

CS1251 的 ADC 带有内部增益温漂补偿功能，通过 GTCSL 以及 GTC[2:0]可以配置。当 GTCSL=1 时为粗调档，此时对应 GTC[2:0]增益温漂补偿的一个步长为 30ppm/°C，可用于补偿外部传感器的温漂；而当 GTCSL=0 时，相应步长为 5ppm/°C，可用于调整芯片内部的增益温漂。

### 3.3 数字滤波器

从 Sigma-delta ADC 出来的数据是 1 位的高速比特流数据，并且包含了大量的高频噪声，因此需要数字滤波器对该比特流数据进行滤波和比特率转换，将高频噪声滤除、同时完成降采样，将 1 位高速比特流数据变成 24-bit 的二进制码数据。这个工作通过多阶的 COMB 滤波器完成。COMB 滤波器之后可以选择是否使用滤波器进一步进行滤波。

#### 3.3.1 频率响应

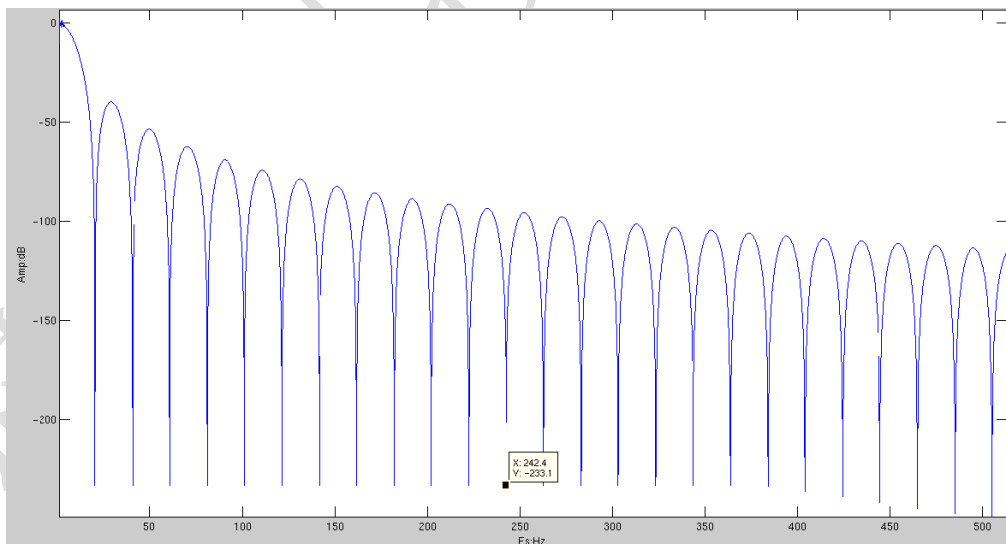


图 3-3 COMB 滤波器的频率响应特性( $F_s=331\text{Hz}$ ， $DR=10\text{Hz}$ ，3 阶 COMB)

#### 3.3.2 建立时间

正常模式下数字 COMB 在低速是 3 阶(10Hz、20Hz、40Hz、80Hz)，高速时是 4 阶或 5 阶(160Hz、

320Hz、640Hz、1280Hz); 占空比模式下，数字 COMB 是 4 阶或 5 阶。数据建立时间跟 COMB 的阶数有关，3 阶 COMB 的数据在第三个能够建立好；4 阶 COMB 的数据在第四个能够建立好；5 阶 COMB 的数据在第五个能够建立好。

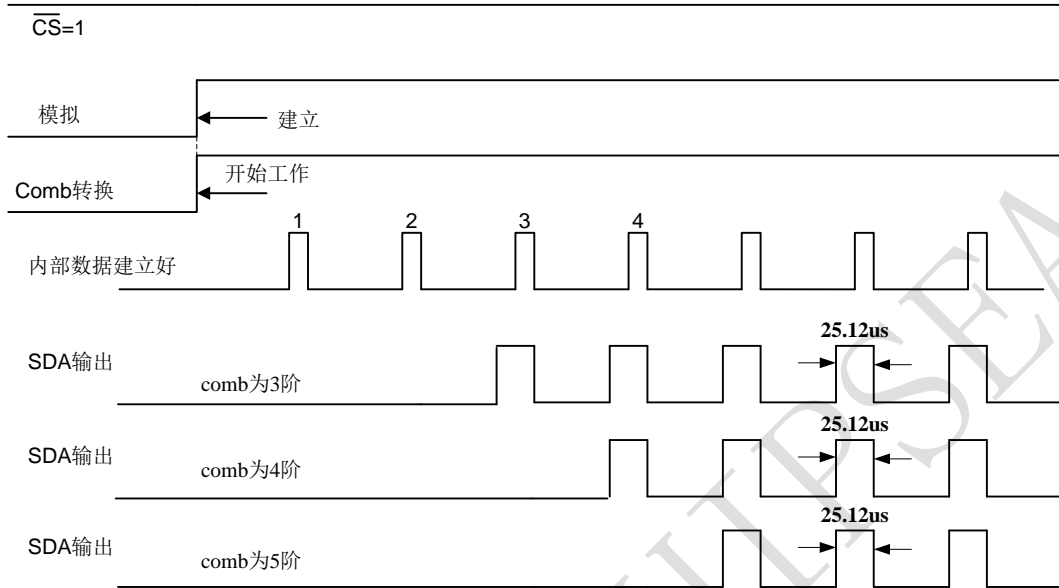


图 3-4 COMB 建立过程

如果 FIL\_EN 设置为 1，数据建立时间更长，所需时间如下表所示（数据误差收敛到在万分之一以内的时间）。

FILCON1	FILCON0	建立时间
0	0	COMB 数据建立时间+300ms
0	1	COMB 数据建立时间+590ms
1	0	COMB 数据建立时间+230ms
1	1	COMB 数据建立时间+460ms

### 3.4 人体阻抗测量

人体阻抗测量的原理是将人体等效为一个阻容网络，然后让一路电流流过该网络产生一个和网络阻抗成正比的压降，通过 ADC 测得该压降即可换算出阻容网络的等效阻抗；然后通过查询一个表格，将人体等效阻抗换算成人体的组成成分。这个表格通常和人的年龄、性别、身高体重、以及人种有关。(关于人体等效阻抗的阻容网络模型、各成分的电学模型、人体阻抗和人体脂肪含量的关系、以及分段测量、多频率测量原理等请参考人体阻抗测量的相关专业知识)。本芯片内部集成了一个交流人体阻抗测量(BIM)模块。

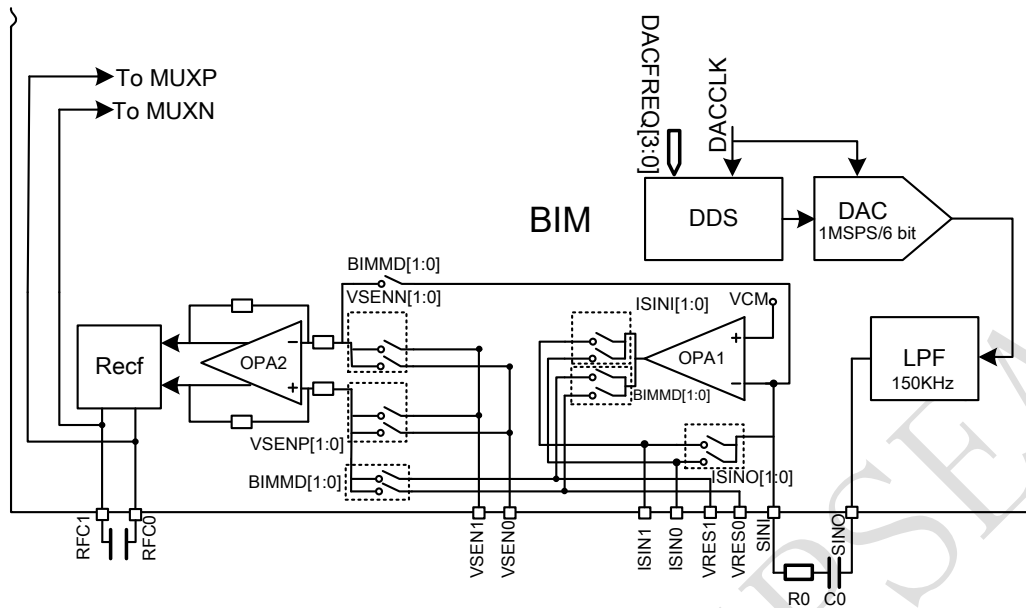


图 3-5 BIM 模块结构图

所示为 BIM 的模块结构图，其中正弦信号发生器（包括 DDS、DAC、LPF 等）可以产生正弦波信号，该信号经过 C0、R0 做高通滤波及限流后转换为正弦电流，并通过至少一对激励电极（端口 ISIN<sub>x</sub>, x=0,1，安装在人体不同的两个部位，一个负责发射正弦电流激励信号，一个负责接受该激励信号）在人体的等效阻容网络上形成一个电压降；通过测量电极（端口 VSEN<sub>y</sub>, y=0,1）探知该电压降信号后，芯片内部对其进行整流滤波等处理，然后送入 ADC 中测量将模拟电压信号转换为数字信号，从而得到人体阻抗上的电压降值。

### 3.4.1 正弦信号发生器

如图 3-5 BIM 模块结构图所示，正弦信号发生器包括一个直接数字合成器（DDS）、DAC 以及 LPF 低通滤波器；其中 DDS 可以生成正弦波码值序列驱动一个 1-MSPS/6-bit 的 DAC；而 DAC 输出送入一个两阶滤波器，截至频率约 150KHz 的 LPF 中进行滤波，以消除高次谐波；LPF 的输出接一个外部电容 C0 进行隔直，避免有直流电流流入人体，再通过一个限流电阻 R0 接到内部运算放大器 OPA1 的负输入端，将电压信号转换为电流信号，同时将电流限定在安全值 500uA 以内。设激励电流为 I(t)，DAC 输出电压为 VD<sub>DAC</sub>，正弦波幅度为 AMP，角频率为 ω<sub>0</sub>，

$$I(t) = VD_{DAC} / R0 = AMP \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \quad (式 3-3)$$

若电阻 R0 具有 ±20% 的容差，通常可将 R0 设置为 2Kohm，此时输出电流的 RMS 属于安全区域。减小 R0 可以增大电流，提高增益，但要考虑电流对人体的作用。通常平均电流达到 1mA 时，人体将有所感觉。另外，电容 C0 可以选择 10uF（推荐）或 1uF 等。

正弦波频率通过 DACFREQ[3:0] 配置，支持 5KHz、10KHz、25KHz、50KHz、100KHz、250KHz 等频率。

### 3.4.2 激励电极及测量电极

激励电极 ISIN3~ISIN0 可通过 MUX 任意组合成发射电极-接收电极对，用于将激励电流信号  $I(t)$  从一端注入人体，然后在另一端接收；ISINO[1:0]控制 MUX 可将任一激励电极接 OPA1 的输入负端作为发射电极，而 ISINI[1:0]控制 MUX 可将任一激励电极接入 OPA1 的输出端作为接收电极，但发射和接收电极不能为同一电极。

在发射电极和接收电极之间是人体等效阻抗  $Z$ ，流过  $I(t)$  后形成一个压降  $V(t)$ ，

$$V(t) = I(t) \cdot Z = A|Z| \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \theta) \quad (\text{式 3-4})$$

其中  $|Z|$  是等效阻抗  $Z$  的绝对值， $\theta$  是等效阻抗  $Z$  的相角。对于纯阻性阻抗， $\theta = 0$ 。测量电极 VSEN3~VSEN0 可通过 MUX 任意组合成正负测量电极测得上述电压  $V(t)$ ；其中正测量电极接入差分运放 OPA2 的正输入端，可通过 VSENP[1:0] 进行配置；负测量电极接入差分运放 OPA2 的负输入端，可通过 VSENN[1:0] 进行配置。

### 3.4.3 整流

电压信号  $V(t)$  经过差分运放 OPA2 处理后变成一对差分正弦信号送入全波整流模块 Rcf，经整流后再通过 RCF0 和 RCF1 外接电容滤波，产生 DC 信号送入 MUXP/MUXN，进入 ADC 信号链进行测量。在处理的过程中，包括 LPF 环节，会对电流  $I(t)$  和电压  $V(t)$  的幅值有调整，总括起来形成一个增益  $G0$ ，换算到最后整流后的有效值中。

当采用全波整流(FWR)模式时，整流后的电压有效值  $V_{rms,f}$  为：

$$V_{rms,f} = |I(t) \cdot Z| = G0 \cdot AMP \cdot |Z| / \pi \quad (\text{式 3-9})$$

当采用 MIX 整流(MIX)模式时，整流后的电压有效值  $V_{rms,m}$  为：

$$V_{rms,m} = |I(t) \cdot Z| = (G0 \cdot AMP \cdot |Z| / \pi) \cdot \cos \theta \quad (\text{式 3-10})$$

因此，对于只需要知道阻抗绝对值的场景，采用 FWR 模式得到  $V_{rms,f}$  值即可换算得到  $|Z|$ ；对于既要知道阻抗绝对值又希望了解相角变化的场景，可以在采用 FWR 基础上，再使用 MIX 模式得到  $V_{rms,m}$ ，

$$\cos \theta = V_{rms,m} / V_{rms,f} \quad (\text{式 3-11})$$

因为人体阻抗网络是阻容网络，因此  $\theta < 0$ ，所以

$$\theta = -\arccos(V_{rms,m} / V_{rms,f}) \quad (\text{式 3-12})$$

### 3.4.4 阻抗校准

由于非理想因素存在，BIM 在使用前需要校准信号增益和失调。通过 BIMD[1:0] 可以调整 BIM 模式，从测量模式切换到校准模式。

在校准电阻 0 模式下，在 SINI 和 VRES0 之间接电阻  $R_{sd0}$ ，经过 BIM 信号链和 ADC 信号链后，ADC 可以测得的电压有效值：

$$V_{rms,0} = Kb \cdot Rsd0 + V_{os} \quad (\text{式 3-13})$$

在校准电阻 1 模式下，在 SINI 和 VRES1 之间接电阻 Rsd1，经过 BIM 信号链和 ADC 信号链后，ADC 可以测得的电压为：

$$V_{rms,1} = Kb \cdot Rsd1 + V_{os} \quad (\text{式 3-14})$$

式 3-13 和式 3-14 中  $V_{os}$  为失调电压，可在内短模式下测得；而  $Kb$  表示信号增益，理想情况下 (MIX 模式和 FWR 模式存在微小区别，高精度要求场合可分别校正)，

$$Kb = (G0 \cdot AMP / \pi) \quad (\text{式 3-15})$$

但实际上由于  $G0$  随着工艺偏差、信号频率都有变化，因此需要通过联立两方程求得  $Kb$ ，用于人体等效阻抗的计算，因

$$Kb = [(V_{rms,1} - V_{os}) - (V_{rms,0} - V_{os})] / (Rsd1 - Rsd0) \quad (\text{式 3-16})$$

得到了  $V_{os}$  及  $Kb$  的值后，对于实际阻抗  $Z$ ，则有

$$V_{rms,f} = Kb_f \cdot |Z| + V_{os,f} \quad (\text{FWR 模式})$$

$$V_{rms,m} = Kb_m \cdot |Z| \cdot \cos\theta + V_{os,m} \quad (\text{MIX 模式})$$

求得：

$$|Z| = (V_{rms,f} - V_{os,f}) / Kb_f \quad (\text{式 3-17})$$

$$\theta = -\arccos[(V_{rms,m} - V_{os,m}) / (V_{rms,f} - V_{os,f}) \cdot (Kb_f / Kb_m)] \quad (\text{式 3-18})$$

注：当前版本  $Kb$  需要加 0.005 的校正因子。

### 3.5 参考电压源

CS1251 内部集成一个低漂移的 LDO，可以输出电压给 VS，具有 4 档可选，其中 2.35V/2.45V/2.8V/3.0V 主要提供给 VS 使用，用于给内部 ADC 部分供电，负载电流最大 10mA。为保证 VS 正常输出，VDD 需要比 VS 电压高 100mV 以上。典型的温漂系数为 30ppm/°C (-40~85°C)。还包括一个内部参考电压源 VREF，输出为 1.225V，主要用于做测量的参考电压提供给 REFP（外接电容提高精度）或者作为内部参考电压 VREF，典型的温漂系数为 30ppm/°C (-40~85°C)，仅作参考电压，无负载能力。

### 3.6 内部时钟源

CS1251 内部提供一个低漂移的 RC 时钟，时钟频率为 5.898MHz，在 -40~85°C 变化范围内漂移小于 2%，在 2.4~3.6V 的 VDD 电压范围内，变化小于 1%。

### 3.7 测量模式及其切换

CS1251 内部具有多个模拟信号通道，包括 BIM 信号、电源电压信号以及内短。选择不同的输入信号时，通常涉及到通道切换、增益设置、输出速率选择等操作，需要 2~3 条操作指令才能完成配置，切换回来也需要同样的操作指令，上位机软件设计较为繁琐。CS1251 内部有三种不同类型输入信号，加上外部输入信号，则有多达四种输入信号需要处理，在某些应用环境下，例如称重和 BIM 测量应用下，需要频繁在称重和 BIM 测量之间切换，每次切换上位机都要发送 4~6 条指令，较为不便。为了简化软件设计，本芯片内部设计了单命令切换测量模式的结构，通过配置 TMODE[1:0]寄存器在电源电压测量、BIM 测量以及手动模式之间切换。前两种模式下，通道选择、增益配置及输出速率三个参数都是内部固定配置好，不需要用户干预，手动模式下用户可以随意配置相关参数；手动模式下切换至其余任意模式再切换回手动模式时，用户的设置保持不变。

### 3.8 多种工作模式

CS1251 提供了多种工作模式可以选择，包括高性能模式、正常模式、低功耗模式。

高性能模式下，PGA 中 Buffer 打开，ADC 调制器的采样频率为 662.22KHz，此时 ADC 信号链精度最高，增益温漂、线性表现最好，同时 ADC 信号链功耗达到 1.5mA，可应用于需要 10Hz SPS，10000 点以上分度的测量场合。正常模式对性能和功耗进行了平衡，Buffer 旁路，采样频率降低为 331.11KHz，可应用于 10000 分度以下测量场合（例如人体称重），ADC 信号链功耗为 1.2mA。低功耗模式是采用占空比的方式来达到节省功耗的目的。在一个 10Hz 数据更新频率的周期内，数字滤波器以 640Hz 的输出速率工作，开启 ADC 后丢弃前 5 个数据，然后累加相应个数进行平均。

占空比模式下 VREF 输出和数字电路间歇性工作，以降低芯片功耗。

在占空比模式下，COMB 是 4 阶的，工作在高速，SPI 数据输出速率只有 10Hz，COMB 数据输出速率为 640Hz，64 个 COMB 周期 SPI 才输出一个数据，我们可以使 COMB 只输出前 21 个数据 (COMB 前 5 个数据丢失，累加 16 个数据平均输出 (第 6 个到第 21 个))，后面 43 个数据周期关闭 COMB 和 VREF 输出，示意图如下。

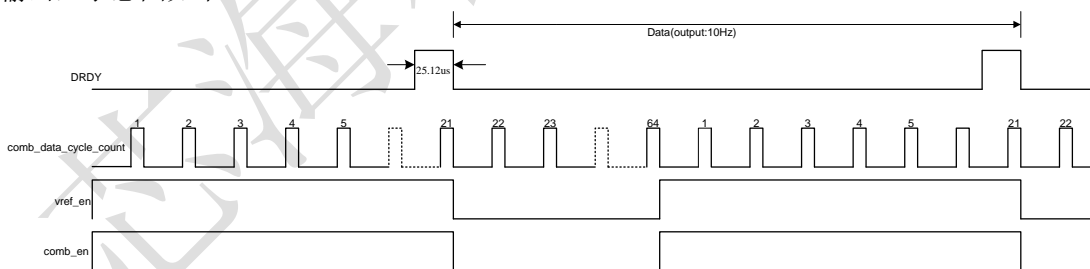


图 3-6 CS1251 低功耗工作示意图

注：COMB 数据输出速率和累加数据个数可以配置。

### 3.9 复位和掉电

当芯片上电时，内置上电复位电路会产生复位信号，使芯片自动复位。



当 SCLK 从低电平变高电平并保持在高电平超过  $172\mu\text{s}$ ，CS1251 即进入掉电（PowerDown）模式。当 SCLK 重新回到低电平时，芯片会重新进入正常工作状态。

当系统由掉电模式重新进入正常工作模式时，此时所有功能配置为掉电模式之前的状态，不需要进行功能配置。

## 4 转换有效位

表 4-1 ADC 信号链不同配置下的有效位(ENOB)

PGA	ADGN	BUFBP	PMODE	TMODE	DR	ENOB
32	2	ON	00	00	10Hz	TBD
32	2	OFF	01	00	10Hz	20.8
32	2	OFF	10	00	10Hz	TBD
x	x	x	xx	01	10Hz	19.5
x	x	x	xx	10	10Hz	18.2
x	x	x	xx	11	10Hz	21.2

## 5 典型特性

### 5.1 LDO 典型特性

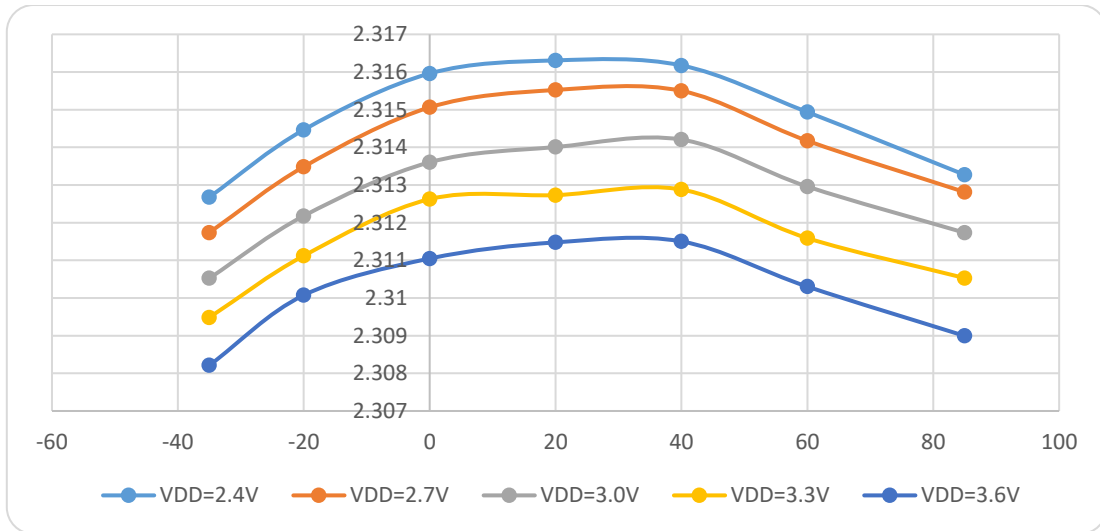


图 5-1 LDO 全电压全温度范围的典型特性(LDOS[1:0]=00, 负载 1mA)

### 5.2 内部时钟典型特性

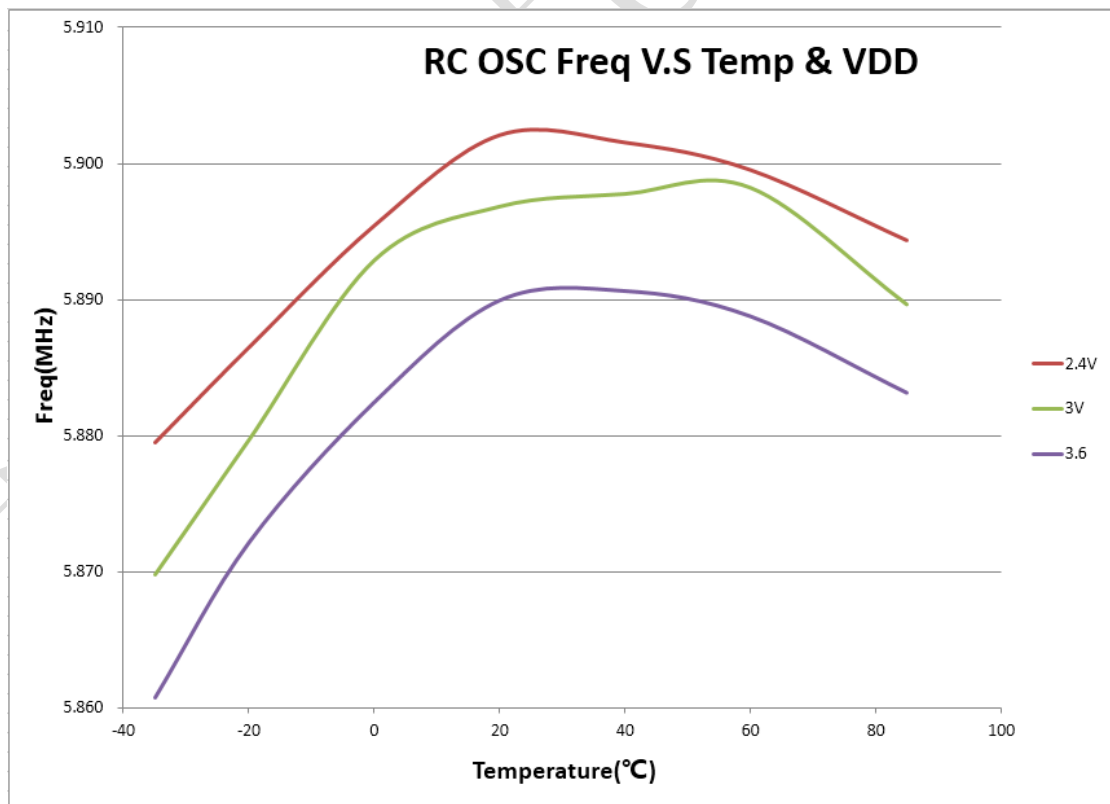


图 5-2 内部时钟全电压全温度范围的典型特性

### 5.3 BIM 典型特性

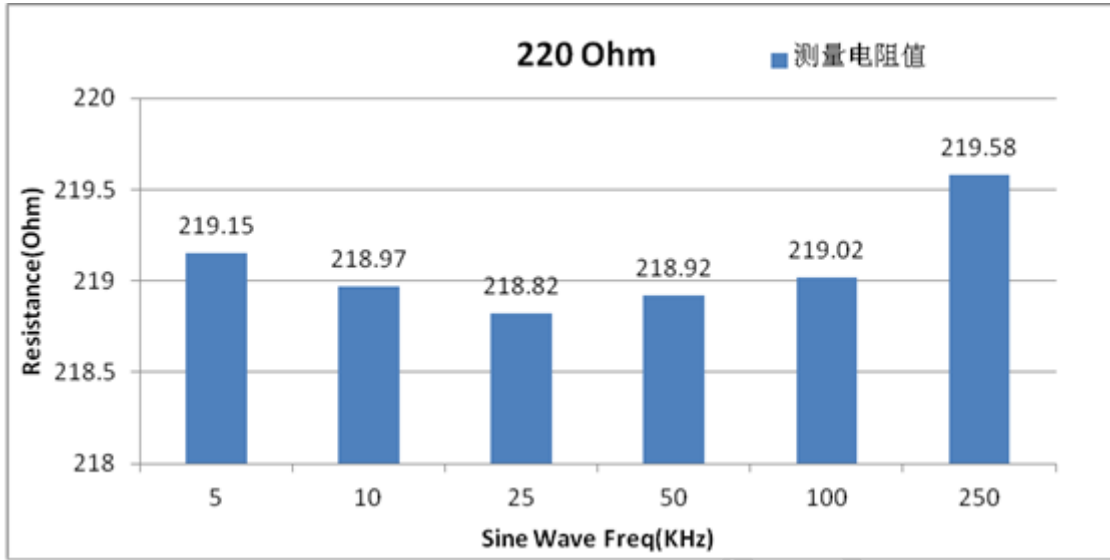


图 5-3 FWR 模式下 220 欧姆纯电阻网络的测试结果

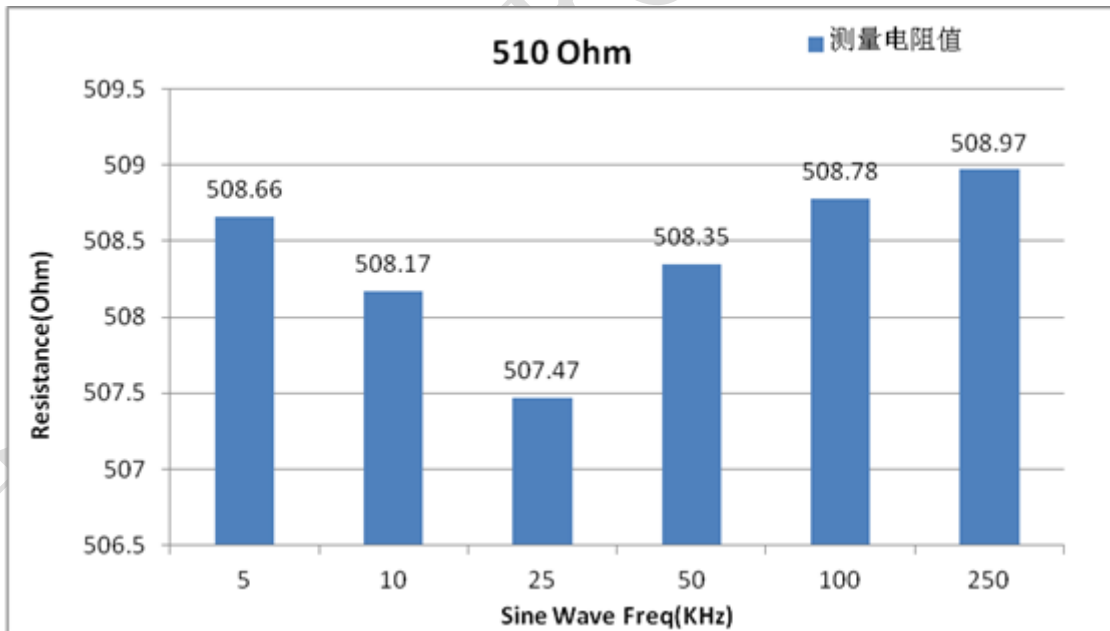


图 5-4 FWR 模式下 510 欧姆纯电阻网络的测试结果

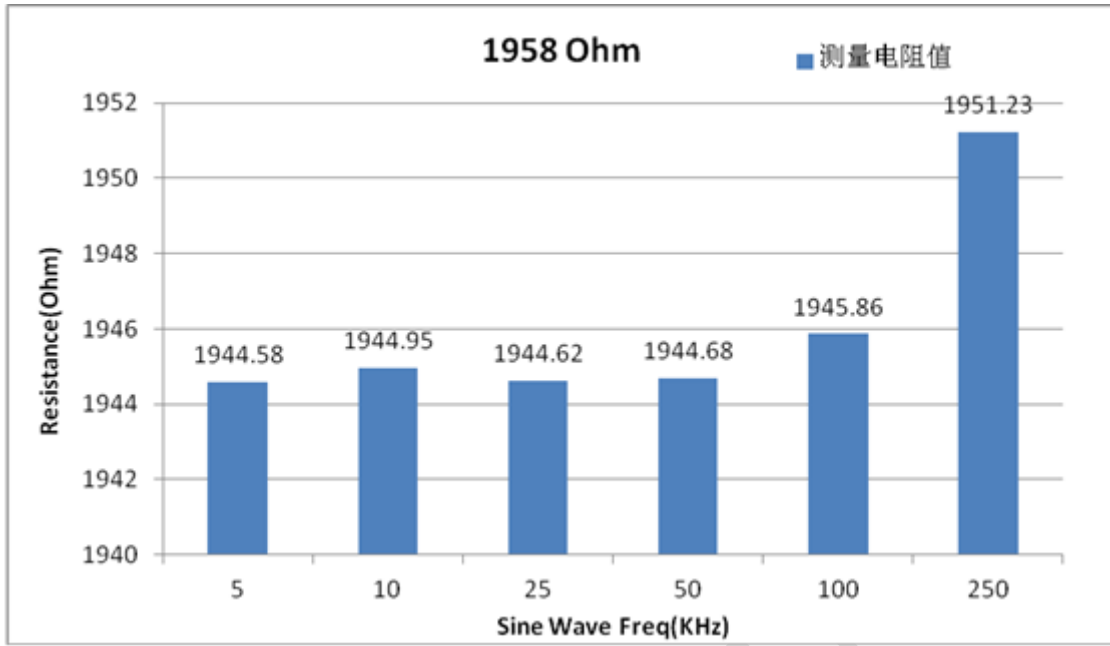


图 5-5 FWR 模式下 1958 欧姆纯电阻网络的测试结果

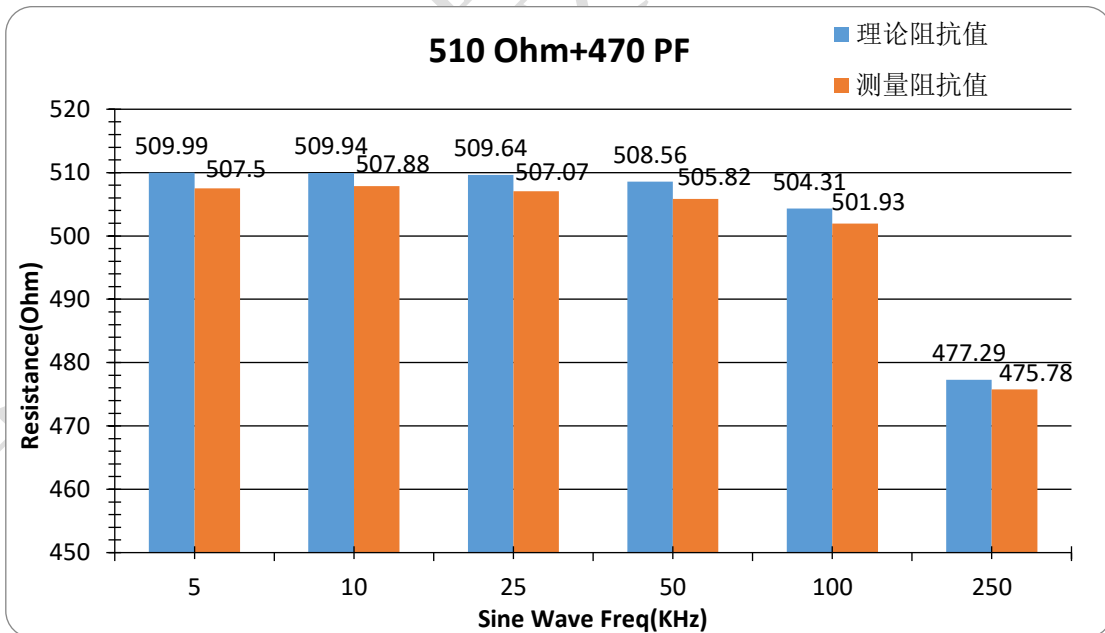


图 5-6 FWR+MIX 模式 510ohm+470pF 并联网络的阻抗绝对值测试结果

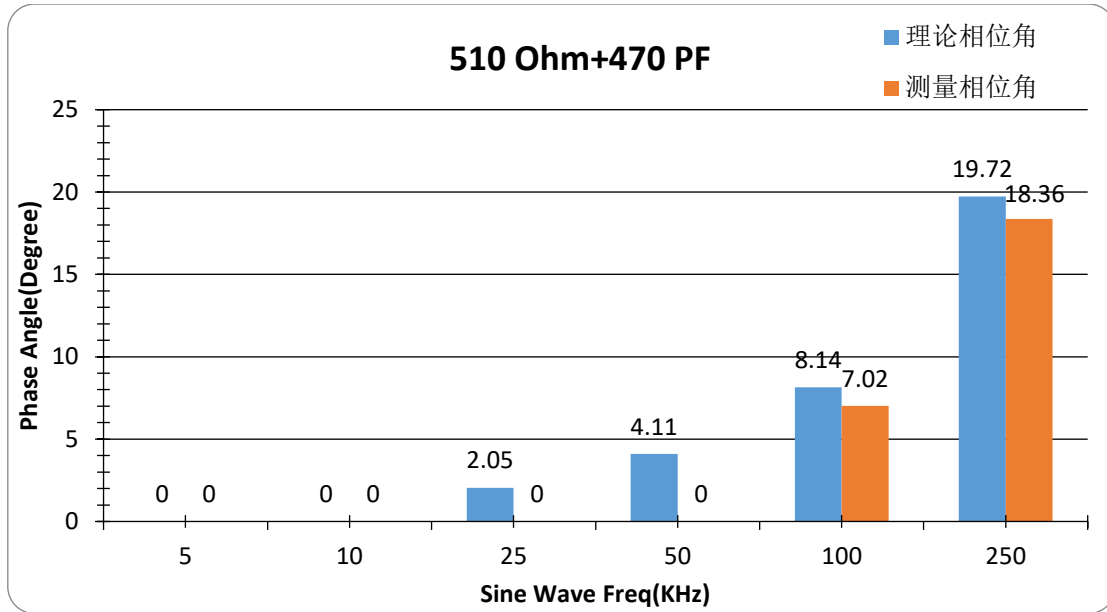


图 5-7 FWR+MIX 模式 510ohm+470pF 并联网络的相位角测试结果

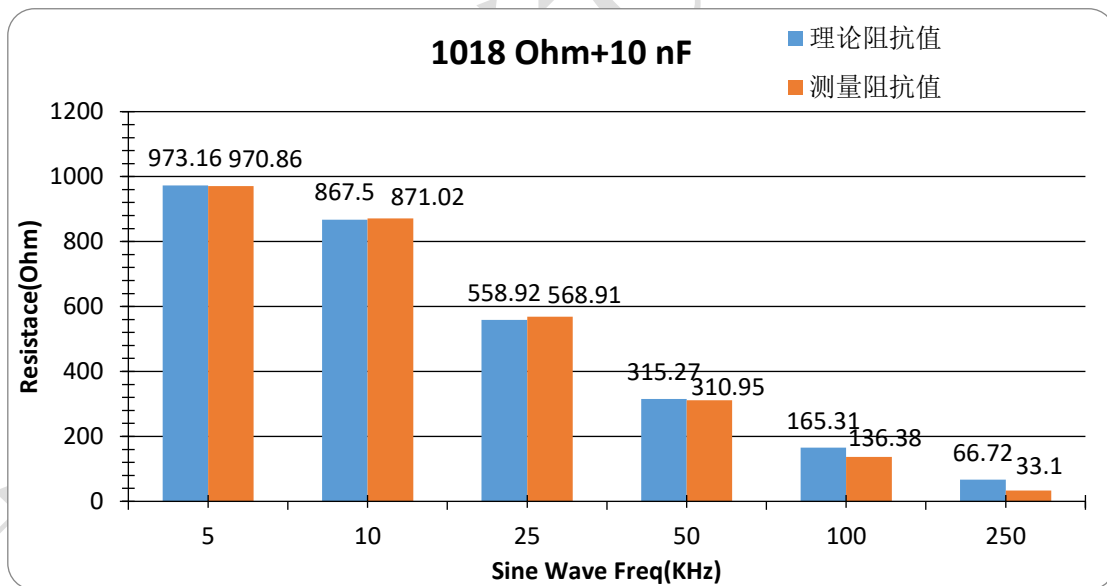


图 5-8 FWR+MIX 模式 1018Ohm+10nF 并联网络的阻抗绝对值测试结果

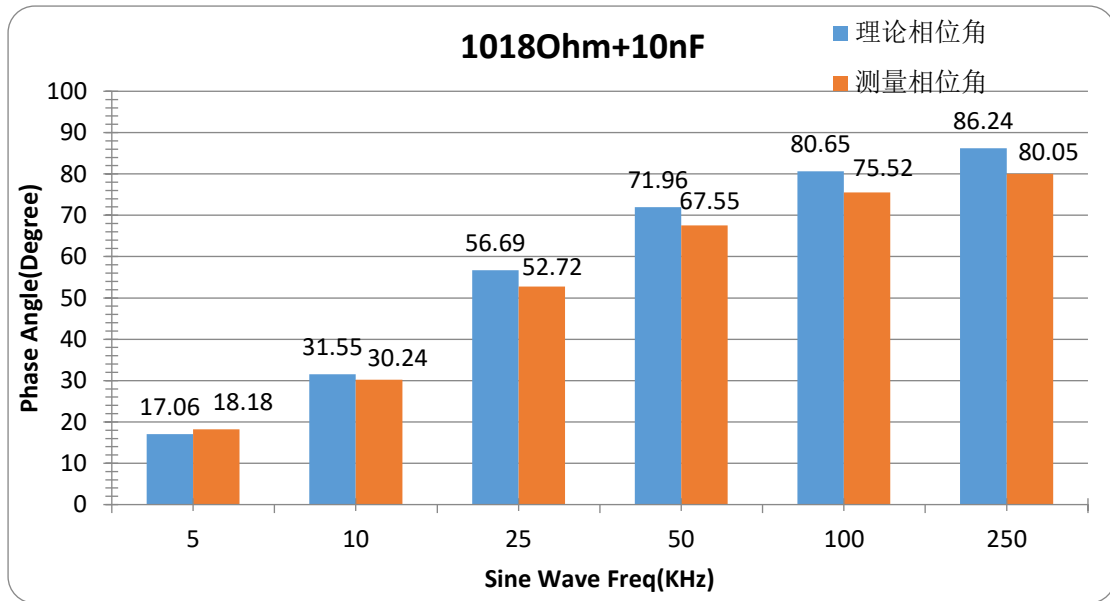


图 5-9 FWR+MIX 模式 1018Ohm+10nF 并联网络的相位角测试结果

## 6 三线串行通讯接口

CS1251 中，采用 3 线串行通信，其中  $\overline{CS}$  为片选/复位信号，SCLK 为通讯时钟、SDA 是双向数据线及数据转换完成标志。

$\overline{CS}$ : 串行接口片选信号，低电平有效，输入信号，内部悬空，建议外接上拉电阻； $\overline{CS}$  由高电平变为低电平时，表示当前芯片被选中，处于通讯状态； $\overline{CS}$  由低变电平变为高电平，表示通讯结束，通讯口复位处于空闲状态。

SCLK: 串行时钟输入脚，决定数据移出或移入 SPI 口的传输速率。所有的数据传输操作均与 SCLK 同步，在上升沿将数据从 SDA 引脚输出；在下降沿读取 SDA 上的数据。

SDA: 串行数据输入/输出脚。 $\overline{CS}=1$ ，SDA 输出 DRDY，表示 ADC 转换数据已准备好； $\overline{CS}=0$ ，SDA 串行通讯数据端口。

串行通讯的命令寄存器是一个 8bits 宽的寄存器。对于读写操作，命令寄存器的 bit7 用来确定本次数据传输操作的类型是读操作还是写操作，命令寄存器的 bit6-0 是读写的寄存器的地址。对于特殊命令操作，命令寄存器的 bit7-0 固定为 0xEA。

注：当 SCLK 保持低电平 687us 左右进入通讯复位模式（只复位串行通讯接口，防止串行通讯接口进入异常无法通讯，不复位芯片）。

表 6-1 串口通讯命令列表

命令名称	命令寄存器	数据	描述
读命令	{0,REG_ADR[6:0]}	Read_Data	从地址为 REG_ADR[6:0]的寄存器中读数据。 注：读无效地址，返回值为 00h
写命令	{1,REG_ADR[6:0]}	Write_Data	向地址为 REG_ADR[6:0]的寄存器中写数据
复位指令	0xEA	0x96	复位指令，接收到指令之后，芯片复位。

### 6.1 读时序

工作过程：

外部设备在  $\overline{CS}$  有效后，先通过 SDA 写入读命令字节，CS1251 接收到读命令后，在 SCLK 的上升沿将数据按位从 SDA 引脚输出。注意：

- 1) 以字节为单位传输，高比特位在前，低比特位在后；
- 2) 多字节寄存器，先输出高字节内容，再传输低字节内容；
- 3) 外部设备在 SCLK 上升沿写命令字节，CS1251 在 SCLK 上升沿将数据从 SDA 输出；
- 4) 数据字节之间的时间  $t_1$  要大于等于 2 个系统时钟周期；

5) 最后一个字节的 LSB 传送完毕， $\overline{CS}$  由低变高结束数据传输。SCLK 下降沿和  $\overline{CS}$  上升沿之间的时间  $t_2$  要大于等于 2 个系统时钟周期；



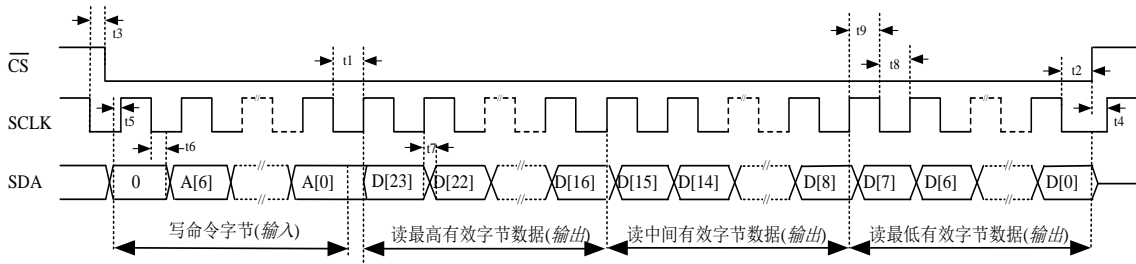


图 6-1 读操作时序 1(读 AD 值)

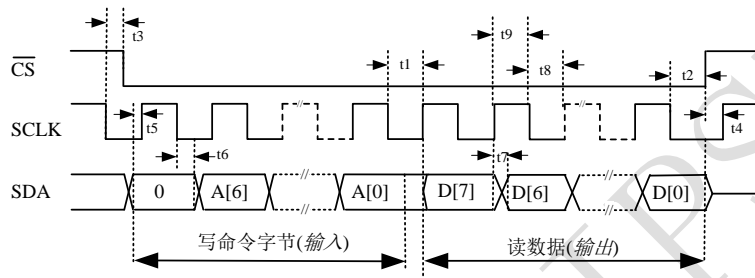


图 6-2 读操作时序 2(除 AD 值之外的寄存器)

## 6.2 写时序

工作过程:

外部设备在  $\overline{CS}$  有效后，先通过 SDA 写入命令字节，再写入数据字节。注意:

- 1) 以字节为单位传输，高比特位在前，低比特位在后；
- 2) 多字节寄存器，先传输高字节内容，再传输低字节内容；
- 3) 外部设备在 SCLK 上升沿写数据，CS1251 在 SCLK 下降沿沿读取数据；
- 4) 数据字节之间的时间  $t_1$  要大于等于 2 个系统时钟周期；
- 5) 最后一个字节的 LSB 传送完毕， $\overline{CS}$  由低变高结束数据传输。SCLK 下降沿和  $\overline{CS}$  上升沿之间的时间  $t_2$  要大于等于 2 个系统时钟周期。

注意：有写保护功能的寄存器在写操作之前要先写入写使能命令。

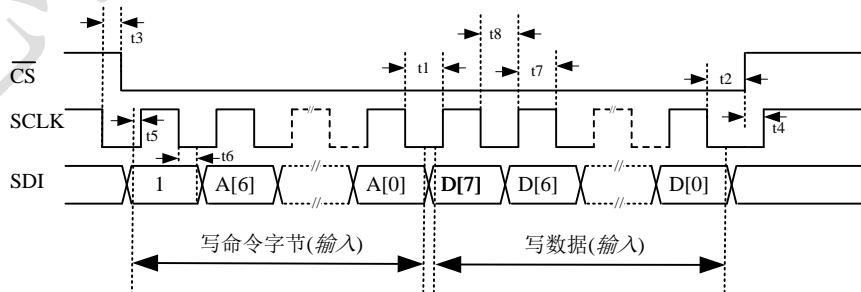


图 6-3 写操作时序

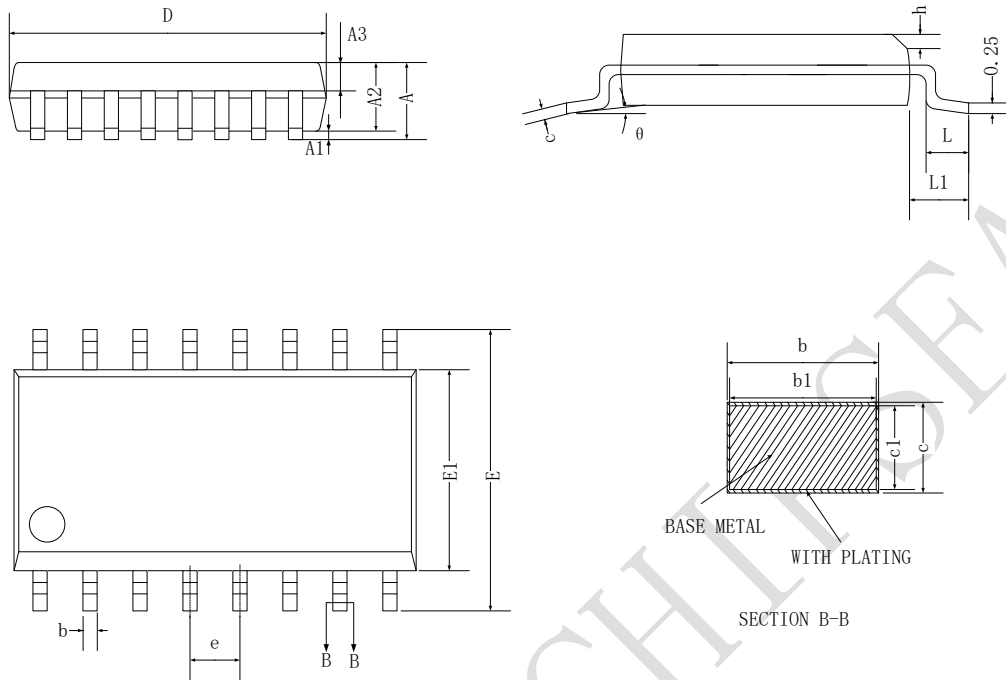
表 6-2 三线串行通讯接口时序表

(VDD=3V, GND=0V, Fosc=5.898MHz, Tosc=1/Fosc, 常温)

名称	解释	Min	Typ	Max	Unit
t1	数据字节之间 SCLK 维持低电平的时间	2*Tosc	-	-	ns
t2	最后一个 SCLK 下降沿与 CS 上升沿之间的时间间隔	2*Tosc	-	-	ns
t3	CS 下降沿之前 SCLK 保持为低的时间	5	-	-	ns
t4	CS 上升沿之后 SCLK 保持为低的时间	5	-	-	ns
t5	在 SCLK 上升沿之前，SDA 上有效数据的建立时间	5	-	-	ns
t6	在 SCLK 下降沿之后，SDA 上有效数据的保持时间	Tosc	-	-	ns
t7	在 SCLK 上升沿之后，SDO 能稳定输出所需要的时间	50	-	-	ns
t8	SCLK 的高电平宽度	2*Tosc	-	170	us
t9	SCLK 的低电平宽度	2*Tosc	-	680	us

## 7 封装

CS1251 采用 SOP16 封装，详细封装形态以 SOP16L 为主。



SOP16L产品外形图

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
SOP16L			
A	—	—	1.75
A1	0.05	—	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	—	0.48
b1	0.38	0.41	0.43
c	0.21	—	0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.70	9.90	10.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
h	0.25	—	0.50
L	0.50	—	0.80
L1	1.05BSC		
$\theta$	0	—	8°

图 7-1 芯片封装尺寸信息

## 8 包装材料信息

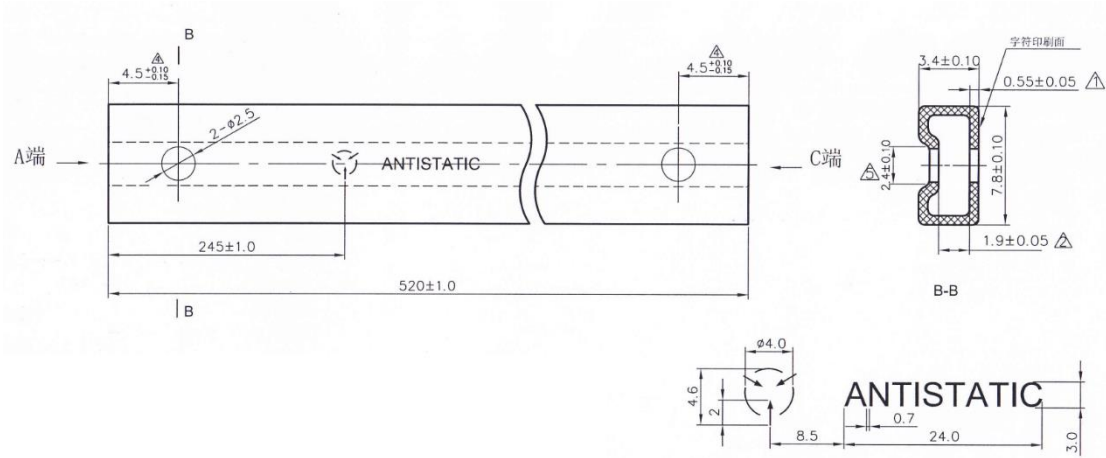


图 8-1 SOP16 料管尺寸

包装方式:

- 1) 芯片用料管装，芯片第一 PIN 脚朝料管的白塞；
- 2) 每二十管整齐层叠后，两端用橡皮筋捆扎，再将五捆一起捆扎；
- 3) 料管装入黑色防静电袋不封口，再放入内盒包装；
- 4) 从里到外包装数量为 50EA/管、5000EA/盒、50000EA/箱；

## 9 产品丝印图说明

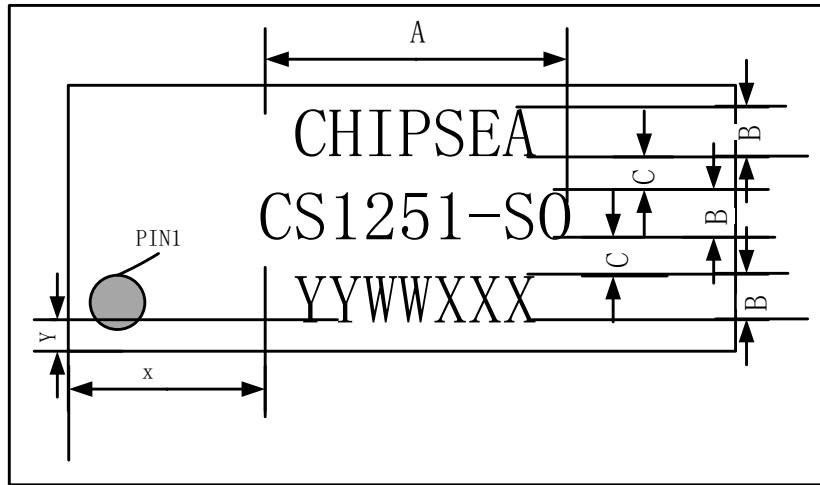


图 9-1 产品丝印图

X	Y	A	B	C
2.5	0.6	5.00	0.6	0.25
基准尺寸	基准尺寸	印章总宽	字符高	行间距
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 印字字体为：Arial，第一、第二行、第三行字体笔画加粗；</li> <li>2) 印章“YYWW”代表实际年周号；</li> <li>3) 印章“XXX”代表可变内容，用于我司内部管控；</li> <li>4) 印章位置与尺寸见图示；</li> <li>5) 打印方式为激光正印；</li> <li>6) 单位 mm ,公差±0.05mm。</li> </ol>				